

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 240

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 23.06.2026

 AP 240	Nazwa i adres / Name and address Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce Laboratorium Zaawansowanych Technik Pomiarowych INTERLAB Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.01 długość 6.02 kąt 6.03 długość (geometria powierzchni)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 240 z dnia 23.06.2026 r.
Cykl akredytacji od 23.06.2026 r. do 22.06.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 240 of 23.06.2026
Accreditation cycle from 23.06.2026 to 22.06.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar ul. Wrzosowa 46, 25-211 Kielce				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Walce wewnętrzne	100 mm do 1000 mm	$Q[4; 3 \cdot D] \mu\text{m}$ <i>D</i> – wielkość mierzona (m)	S	Procedura wewnętrzna IW3_PL
Dalmierze laserowe	500 mm do 12000 mm	0,7 mm	S	Procedura wewnętrzna IW1_PG
Tachimetry	500 mm do 12000 mm	0,3 mm	S	Procedura wewnętrzna IW1_PG
Kąt				
Kątowniki 90° dwuramienne	do 1000 mm	1,0''	S	Procedura wewnętrzna IW2_PL
Długość (geometria powierzchni)				
Wzorce chropowatości typu A Pt	0,1 μm do 15 μm	60 nm	S	PN-EN ISO 5436-1:2002
Wzorce chropowatości typu B1 Ra	0, 5 μm do 15 μm	$Q[15; 25 \cdot R_a] \text{ nm}$ <i>R_a</i> – wielkość mierzona (μm)	S	PN-EN ISO 21920-2:2022-06 PN-EN ISO 21920-3:2022-06
Wzorce chropowatości typu C Ra, Rq Rz, Rt, Rp, Rv	0,05 μm do 15 μm do 1000 μm	$Q[15; 25 \cdot R_a] \text{ nm}$ <i>R_a</i> – wielkość mierzona (μm) $[40; 50 \cdot R_p] \text{ nm}$ <i>R_p</i> – wielkość mierzona (μm)	S	PN-EN ISO 21920-2:2022-06 PN-EN ISO 21920-3:2022-06
Wzorce chropowatości typu D Ra, Rq Rz, Rt, Rp, Rv, Rmax	0,05 μm do 15 μm do 1000 μm	$Q[15; 25 \cdot R_a] \text{ nm}$ <i>R_a</i> – wielkość mierzona (μm) $[40; 60 \cdot R_p] \text{ nm}$ <i>R_p</i> – wielkość mierzona (μm)	S	PN-EN ISO 21920-2:2022-06 PN-EN ISO 21920-3:2022-06
Wzorce powiększenia Pt	do 15 μm	200 nm	S	Procedura wewnętrzna IW1_PL

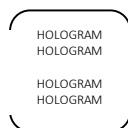
Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w postaci równania $Q[a; b]$ oznacza pierwiastek sumy kwadratów wyrazów w nawiasach: $Q[a; b] = (a^2 + b^2)^{1/2}$.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 240

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA ds. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 23.06.2026 r.